

## АНОМАЛИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПЛЕНОК $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$ В ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА

**А.А. АГАСИЕВ, А.О. АЛИЕВ, М.Г. АГАЕВ**

*Бакинский Государственный Университет им. М.Э. Расулзаде  
370148, Баку, ул. З. Халилова, 23*

Магнетронным распылением на постоянном токе получены пленки твердого раствора  $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$  стехиометрического состава. В широком температурном интервале исследована электропроводность структур  $Me-Sb_2S_3-Sb_2Se_3-Me$  в планарном и «сэндвич» конфигурациях. Показано наличие аномалии в температурной зависимости электропроводности пленок при «сэндвич» конфигурациях. Аномалия проводимости объясняется наличием спонтанной поляризации в пленках.

Интерес к полупроводниково-сегнетоэлектрическим соединениям связан в первую очередь с существованием в них сегнетоэлектрических фазовых переходов и высокой фоточувствительности. В области фазового перехода их кристаллическая решетка неустойчива, физические свойства нелинейные, а их полупроводниковые параметры становятся экстремальными. Соединения  $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$  кристаллизуются в ромбической решетке ( $D_{2h}^{16}$ ) и обладают достаточно высокой и сильно анизотропной диэлектрической проницаемостью [1].

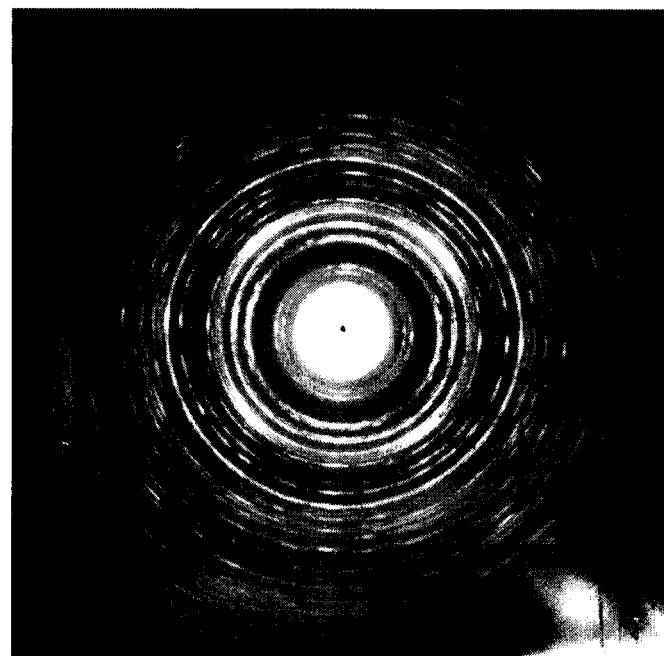
Требования новой техники не могут быть удовлетворены использованием только керамики и монокристаллов. Таковыми являются микро-миниатюризация устройств, снижение их электроемкости, повышение чувствительности и быстродействия элементов при одновременном уменьшении управляющих полей. Использование пленок не только решает эти проблемы, но и расширяет функциональные возможности. Поэтому интенсивное исследование тонких пленок вполне оправдано. Ибо пленки представляют собой модель уникальную для изучения и выяснения роли дефектов строения в спонтанной деформации решетки, а в случае сегнетоэлектрических пленок вариация структурного упорядочения и толщины пленки, типа и плотности дефектов в ней реализуются условия критические к сегнетоэлектрическому состоянию.

В связи с тем, что в системе  $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$  наблюдаются фазовые переходы и сегнетоэлектрические явления [2] возникает необходимость выяснить механизм электропроводности и ее поведения в области температуры фазового перехода в пленках.

Пленки для исследований получены магнетронным распылением твердых растворов системы  $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$  на постоянном токе [3]. Магнетронная система с плоским катодом была собрана на основе установки ВУП-4К. В качестве мишени использовали диски диаметром 25 мм и толщиной 3 мм. Расстояние между подложкой и мишенью варьировалось в пределах 3-10 см, при этом напряжение изменялось от 0,2 до 0,6 кв. Структурные исследования пленок проводились на электронном микроскопе ЭМ-14, а химический состав пленок определялся локальным рентгеноспектральным методом на приборе MS-46 путем сравнения отношений интенсивностей спектральных линий для пленок и эталонного образца. Температу-

ра подложек изменялась в пределах 300-900 К и измерялась с помощью Pt, Pt-родиевой термопарой с точностью 1-2 градуса. Для получения однородных по толщине пленок, с помощью специальных приспособлений подложки вращались и двигались поступательно возвратно вблизи мишени. В качестве подложек применялись свежие сколы NaCl, слюды, пластинки ситалла, а также пленки Sb, Au, Al.

Электронограмма пленки состава 50%  $Sb_2S_3$ -50%  $Sb_2Se_3$  представлена на рис.1. Расчет электронограммы показывает соответствие параметров пленки в объеме образца.



*Рис.1. Электронограмма пленки  $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$ , осажденной на NaCl при температуре 350°C*

Для измерения электропроводности использовались структуры  $Me-Sb_2S_3-Sb_2Se_3-Me$  в планарном и «сэндвич» конфигурациях. Элементарная ячейка  $Sb_2S_3$  или  $Sb_2Se_3$  состоит из  $4^x$  молекул. Их структуру можно представить как цепочки параллельные оси «С». В цепочках осуществляется сильная связь, а между слоями действует ковалентная сила связи [4].

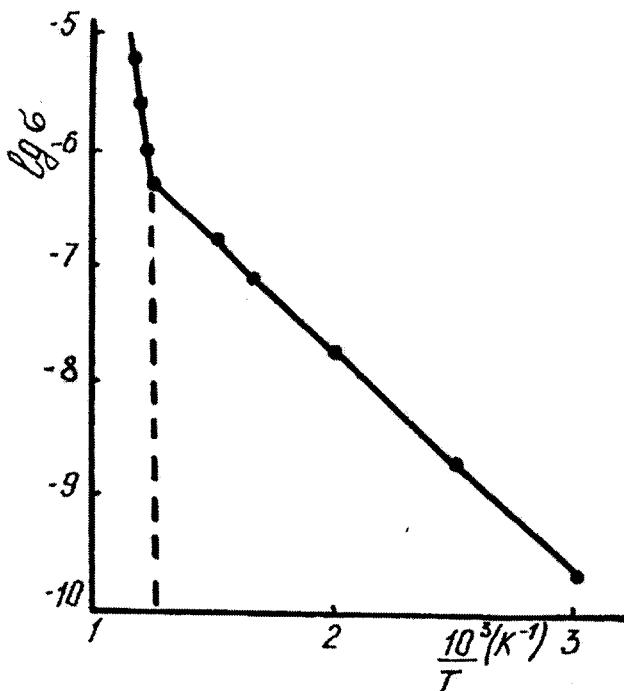


Рис.2. Температурная зависимость электропроводности пленки  $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$  в “сэндвич” конфигурации.

Измерения показали, что в области температуры фазового перехода в направлении оси - «С» («сэндвич» структура) электропроводность обнаруживает аномалию (рис.2), сопровождающуюся скачком электропроводности. При этом наблюдается уменьшение электропроводности и увеличение энергии активации. В направлении перпендикулярном оси - «С» (планарная структура) аномалия электропроводности не обнаружена (рис.3) и  $\sigma$  - претерпевает простой излом.

Аномалия электропроводности, видимо, связана с наличием поляризации в слоях системы  $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$ . Влияние сегнетоэлектрического фазового перехода на температурную зависимость сегнетоэлектриков-полупроводников определяется двумя факторами. Первый - это зависимость от квадрата поляризации ( $P_s^2 \sim (T - T_c)$ ) параметров проводимости (излом в точке фазового перехода на графике зависимости энергии активации от об-

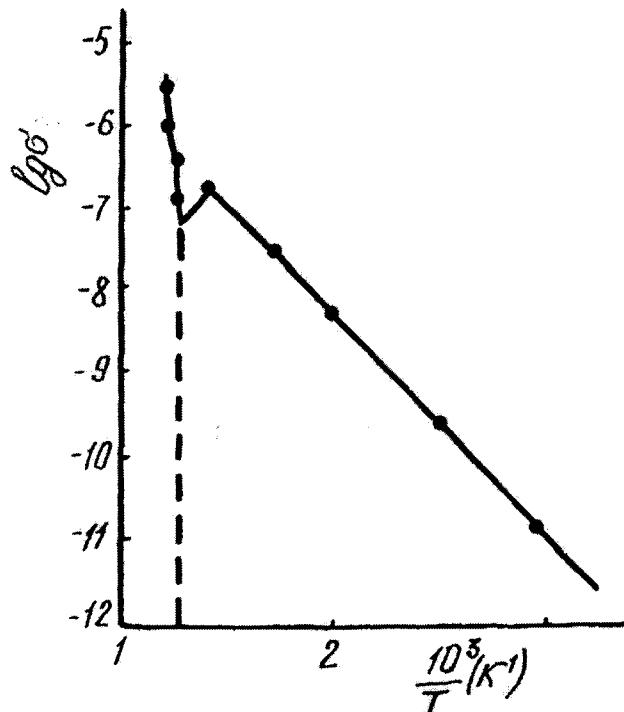


Рис.3. Температурная зависимость электропроводности пленки  $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$  в планарной конфигурации.

ратной температуры является примером такого рода). Второй фактор - это экранирование спонтанной поляризации. Действительно, при изменении спонтанной поляризации изменяется экранирующий ее заряд, в том числе и на ее часть, которая обусловлена подвижными носителями. Очевидно, что если первый фактор присутствует как в объемных образцах так и в пленках, то второй только в пленках, толщина которых соизмерима с длиной экранирования. В планарной геометрии экранирующие заряды занимают объем составляющей  $L_s/\sqrt{3}$  часть всего объема пленки, а в «сэндвич» конфигурации - весь объем. Поэтому должна наблюдаться существенная разница в поведении температурной зависимости проводимости в области фазового перехода для планарной и «сэндвич» конфигураций.

- [1] А.Г. Хасабов, И.Я. Никифоров. Кристаллография 1971, т. 16, вып. 1, с. 41.  
[2] К.А. Верховская, И.П. Григав, В.М. Фридкол. ФТТ, 1968, т. 10, с. 2015.

- [3] A.A. Agasiev, V.I. Orbun and M.Z. Mamedo. J. Phys. III, France, 1994, 4, p.2521-2529.  
[4] N.W. Tioleswol, F.N. Kcuse, I.D. Necullongh. Acta Cryst, 1959, v. 10, p. 99.

A.A. Ağasiyev, Ə.O. Əliyev, M.H. Ağayev

## FAZA KEÇİDLƏRİ OBLASTINDA $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$ SİSTEMİNİN NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTRİKKEÇİRİCİLİYİNİN ANOMALİYASI

Sabit cərəyan rejimində maqnetron tozlanması vasitəsilə  $Sb_2S_3-Sb_2Se_3$  sistem bərk məhlullarının stekiometrik tərkibli nazik təbəqələri alınmışdır. Geniş temperatur intervalında  $Me-Sb_2S_3-Sb_2Se_3-Me$  quruluşunun planar ve “Sendvic” konfiqurasiyalarında elektrikkeçiriciliyi tədqiq olunmuşdur. “Sendvic” konfiqurasiyasında nazik təbəqələrin elektrikkeçiriciliyinin temperatur asılılığının anomaliyası müşahidə olunmuşdur. Elektrikkeçiriciliyin anomaliyası nazik təbəqələrdə spontan polyarizasiyanın olması ilə izah edilmişdir.

# **АНОМАЛИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПЛЕНОК $\text{Sb}_2\text{S}_3$ - $\text{Sb}_2\text{Se}_3$ В ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА**

**A.A. Agasiyev, A.O. Aliyev, M.H. Agayev**

## **ANOMALY OF ELECTROCONDUCTIVITY IN $\text{Sb}_2\text{S}_3$ - $\text{Sb}_2\text{Se}_3$ FILMS IN THE PHASE TRANSITION REGION**

The films of  $\text{Sb}_2\text{S}_3$ - $\text{Sb}_2\text{Se}_3$  solid solution of stoichiometric composition have been obtained by magnetron sputtering with dc. The electroconductivity of Me- $\text{Sb}_2\text{S}_3$ - $\text{Sb}_2\text{Se}_3$ -Me structures in planar and “sandwich” configurations have been studied in a wide temperature region. The anomaly in the temperature dependence of film electroconductivity with “sandwich” configuration has been shown. The anomaly of electroconductivity is explained by spontaneous polarization.

*Дата поступления: 22.10.98*

*Редактор: С.А. Алиев*